

第 47 回 信頼性・保全性シンポジウム 展示企業の出展内容

出展企業	内藤電誠工業株式会社 設計・評価事業部 評価解析部		
E-メール	ndkz-hyouka@ndk-reliability-lab.com		
TEL	044-811-5496	担当者	評価営業：山崎／金坂／後藤

弊社では、各種信頼性試験・環境試験及び調査解析(物理解析・断面解析)受託サービスでお客様の品質向上をサポート致します

信頼性評価

ONE STOP Service

調査解析

ONE STOP Service

ハイパワー恒温恒湿試験

温度サイクル試験

導体抵抗モニタシステム

染色試験(Dye & Pry)

前処理試験

リポール

熱抵抗測定システム/シミュレーション

引継解析

- 電気的特性解析
- X線CT観測
- マイクロリーク/ガス交換観測
- 超音波探傷(SAT)解析
- ワイヤリーハンダ
- ワイヤリーハンダ(PIE)
- 超音波探傷

X線(2D)画像

CT(3D)画像

超音波探傷(SAT)解析

銅ワイヤー開封

断面加工/SEM観測/EDX分析

断面解析

平面解析

LED開封

次世代パワー半導体の信頼性試験

お客様の満足して頂ける受託信頼性サービスを提供いたします



次世代パワー半導体の耐熱信頼性評価に**最適**です。

300℃対応冷熱衝撃試験槽

幅広い温度制御範囲
低温側 -70℃~0℃
高温側 +300℃~+180℃⇒従来機(Max+200℃)
高温領域の拡大制御が可能です。

ハイパワー恒温恒湿試験槽

幅広い温度制御範囲
低温側 -75℃、高温側+180℃、湿度10~90%RH
覆れた温度上昇・下降速度
約2℃/分の温度サイクルを制御(-75℃~+180℃)
熱負荷時の温度変化: 約4℃/分(-49.5℃~+164.5℃)

電子デバイスの物理解析

お客様の品質向上をサポートいたします

電子部品の特性測定・非破壊～破壊解析

・振動試験
・V-I特性

・PK試験
・ドライエッチング

・X線CT観測
・超音波探傷

・X線CT観測
・超音波探傷

マルチフォーカスX線CT観察事例(非破壊解析)

スマートフォン コネクタ不良の観察

<現状>
USB接続によるデータアクセスや充電が正常にできなくなった為、コネクタに着目しX線CT観察を行った事例です。
このように、非破壊でコネクタの端子折れ、変形が確認できます。

X線透視観察

X線CT観察

<コネクタ端子平面断面>

<コネクタの断面>

<端子折れ 端子の変形 端子の歪み 端子の剥離>

<端子変形の断面>

<3D像>